

分析機能付き走査電子顕微鏡

機器利用ライセンス制度対象機器

計測分析技術グループ TEL 03-5530-2646 FAX 03-5530-2629

特徴

- 試料表面の微小領域を観察
- 元素の定性分析
- 付属のコーターや低真空SEMを用いることで、絶縁体でも観察・分析が可能

試料表面に電子線を当て、出てくる電子を使って小さなものを大きく拡大して見ることができます。表面の状態や形状の観察をすることができます。

また電子が当たったときに発生する特性X線を利用することで、微小な領域の元素分析（定性分析）をすることも可能です。

初めて利用されるときの利用方法習得セミナーは、マンツーマンで3時間実施いたします。



JSM-6490LA（日本電子株式会社製）

主な仕様

電子銃	熱電子放出（Wフィラメント）
実用倍率	数万倍程度まで
検出器	二次電子、反射電子、エネルギー分散形X線（測定可能元素： ${}^5\text{B}$ から ${}_{92}\text{U}$ まで）
試料台径	Φ32, 51, 76 mm
試料高さ	60 mmまで
試料重量	1 kgまで
備考	<ul style="list-style-type: none"> 付属のコーター（金、白金、炭素）や低真空SEMを用いて、絶縁体でも観察・分析可 水分・揮発成分を含む試料は観察不可

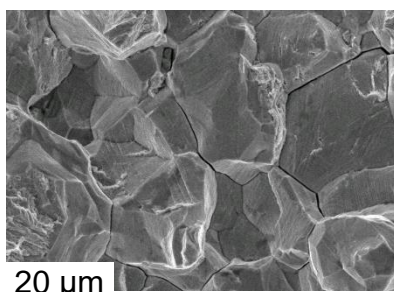
料金の一例

依頼試験項目	中小料金	一般料金
像の観察 [1試料につき]	¥12,460	¥18,100
写真撮影 [1撮影につき]	¥2,890	¥4,410
定性分析 [1測定点につき]	¥9,100	¥13,610
線分析または面分析 [1測定につき]	¥14,960	¥26,000
機器利用項目	中小料金	一般料金
基本料 [最初の1時間]	¥3,560	¥7,130
追加料 [1時間ごと]	¥1,550	¥3,100
機器利用指導料 [30分につき]	¥1,130	¥2,260
CD-R [利用する度に1枚]	¥50	¥50

その他詳細については、職員までお問い合わせください。

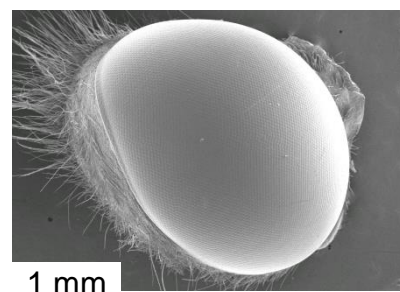
活用事例

- 数μmまでの微小領域観察
- 元素分析（定性分析）



20 μm

図1 金属破断面（粒界破壊）



1 mm

図2 蟬の目（複眼、自然乾燥）